



| Specyfikacja | | CM-36dG | CM-36dGV | CM-36d | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--------------------|
| Kolor | Układ oświetlenia i pomiaru | Reflektancja: di:8°, de:8° (oświetlenie rozproszone, kąt obserwacji 8°) Zgodność z normami kolorymetrycznymi CIE No.15 (2004), ISO7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z 8722 warunek C. | | | |
| | | Transmitancja: di:0°, de:0° (oświetlenie rozproszone, kąt obserwacji 0°) Zgodność z normami kolorymetrycznymi CIE nr 15 (2004), ISO7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7 i JIS Z 8722 Condition c. | | N.D. | |
| | Średnica sfery całkującej | Ø152 mm | | | |
| | Detektor | Matryca fotodiod krzemowych (podwójna, 40 fotodiod) | | | |
| | Element rozdzielający widmo | Płaska siatka dyfrakcyjna | | | |
| | Zakres długości fali światła | 360-740 nm | | | |
| | Rozdzielczość widmowa | 10 nm | | | |
| | Szerokość połówkowa | Ok. 10 nm | | | |
| | Zakres reflektancji | 0-200% | | | |
| | | Rozdzielczość: 0,01% | | | |
| | Źródło światła | 3 ksenonowe lampy błyskowe (NUVC) | | 1 ksenonowe lampy błyskowe (NUVC) | |
| | Trwałość źródła światła | Więcej niż 1 milion razy | | | |
| | Średnica pomiaru/ oświetlenia [mm] | LAV: | Ø30.0 / Ø25.4 | | LAV: Ø30.0 / Ø25.4 |
| | | LMAV: | Ø20.0 / Ø16.0 | | MAV: Ø11.0 / Ø8.0 |
| | | MAV: | Ø11.0 / Ø8.0 | | SAV: Ø7.0 / Ø 4.0 |
| SAV: | | Ø7.0 / Ø 4.0 | | | |
| Trans: | | Ø24.0 / Ø17.0 | | | |
| Czas pomiaru | Ok. 3,5 s (SCI + pomiar SCE) Ok. 4 s (SCI + SCE + pomiar połysku) | | Ok. 3,5 s (SCI + pomiar SCE) | | |
| Minimalna przerwa pomiędzy pomiarami | Ok. 4 s (pomiar SCI + SCE) Ok. 4,5 s (SCI lub SCE + pomiar połysku) | | Ok. 4 s (pomiar SCI + SCE) | | |
| Powtarzalność | Odchylenie stand. w granicach ΔE^*ab 0,02 | | Odchylenie stand. w granicach ΔE^*ab 0,03 | | |
| IIA | Średnia ΔE^*ab 0,12 (LAV/SCI) dla pomiaru 12 wzorcowych płytek koloru BCRA serii II w porównaniu do wartości zmierzonych instrumentem odniesienia. | | Średnia ΔE^*ab 0,15 (LAV/SCI) dla pomiaru 12 wzorcowych płytek koloru BCRA serii II w porównaniu do wartości zmierzonych instrumentem odniesienia. | | |
| Regulacja UV | NUVC (UV100 (pełne UV), UV400 nm, UV420 nm, UV0) | | Brak funkcji ustawienia (100% UV) | | |
| Połysk | Geometria pomiarowa | 60° (zgodność z ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530, JIS-Z8741, JIS-K5600) | | N.D. | |
| | Źródło światła | Biała dioda LED | | | |
| | Detektor | Fotodiody krzemowa | | | |
| | Zakres reflektancji | 0-200 GU | | | |
| | | Rozdzielczość: 0,01 GU | | | |
| | Średnica pomiaru [mm] | MAV: Ø10.0 x 8.0 | | | |
| | | SAV: Ø3.0 | | | |
| | Powtarzalność (MAV) | 0-10 GU: w granicach 0,1 GU | | | |
| 10-100 GU: w granicach 0,2 GU | | | | | |
| >100 GU: w granicach 0,2% wskazanej wartości (odchylenie standardowe) | | | | | |
| IIA (MAV) | 0-10 GU: ± 0.2 GU | | | | |
| | 10-100 GU: ± 0.5 GU | | | | |
| Podgląd próbki | Kamera RGB | | | | |
| Wewnętrzna kontrola sprawności | Technologia WAA (analiza i regulacji długości fali) | | | | |
| Interfejs | USB 2.0 | | | | |
| Zakres temperatury/wilgotności otoczenia podczas pracy | od 13 do 33 °C, wilgotność względna 80% lub mniej (przy 35 °C), bez skraplania | | | | |
| Zakres temperatury/wilgotności otoczenia podczas przechowywania | od 0 do 40 °C, wilgotność względna 80% lub mniej (przy 35 °C), bez skraplania | | | | |
| Wymiary [mm] | 248×250×498 mm | 300×677×315 mm | 248×250×498 mm | | |
| Masa [kg] | 8.4 kg | 14.0 kg | 8.3 kg | | |